

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Л. В. КИРЕНСКОГО

Препринт ИФО - 169 *

Л.Н.Богомич, В.Г.Подопригора, А.Н.Воронин,

Н.П.Пестаков, В.Ф.Шабанов

АБСОЛЮТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛИНИЙ КР ФОНОННЫХ
СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Красноярск
1981

В. ВЕДЕНИЕ

Выделена развернутая формула для определения интенсивности линий ИР фононных спектров молекулярных кристаллов. Показана экспериментальная возможность выделение в спектрах ИР продольных и поперечных колебаний. Выделен вклад в интенсивность линий, связанный с электрооптическим взаимодействием поля световой волны с упругими колебаниями кристаллической решетки.

Ответственный за выпуск Н.П.Шестаков

© Институт физики СО АН СССР, г. Красноярск, 1981г.

Потребности науки и техники ставят на повестку дня более глубокое проникновение в тайну строения вещества и изучение микроскопических процессов в нем. Особое место среди методов исследования структуры и свойств материи занимают спектральные методы, дающие прямую информацию о свойствах электронных и колебательных переходов в атомах и молекулах, о природе межмолекулярного взаимодействия и механизмах фазовых переходов.

Одним из самых эффективных методов изучения свойств твердых и жидких тел является спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС). С появлением лазеров (мощных источников монохроматического поляризованного излучения) стали возможными поляризационные исследования низкочастотного спектра ИР решеточных колебаний кристаллов. Изучая этот спектр, получающийся как известно, в результате взаимодействия световой возбуждающей волны с упругими колебаниями кристалла, можно получить сведения о силовых постоянных кристаллической решетки, электрооптических и пьезооптических параметрах, а также различать продольные и поперечные колебания фононов.

Однако сдерживающим фактором развития спектроскопии ИР являлось отсутствие теории интенсивности линий для сложных молекулярных кристаллов, обладающих низкой симметрией. Лишь в последнее время развита теория интенсивности линий фононных спектров молекулярных кристаллов на основе квантово-механического рассмотрения [1-3], для кубических кристаллов с одной молекулой в ячейке.

Для правильной интерпретации динамических процессов в веществе необходимо выделить вклад в интенсивность ИР, обусловленный различными механизмами рассеяния света на фононах. Практический интерес представляет определение вклада, связанного с на-

дипольными факторами спектров, которые позволяют исследо-

вать не интенсивности спектра ИР значение величины, характеризующих, в частности, процесс генерации второй оптической гармоники. Ранее методика нахождения этого вклада из спектральных дан-

ных в яном виде была разработана [3-7] лишь для выкокомпакт-
рических кристаллов, в приближении ориентированного газа, на ос-

нове орангительного изучения интенсивности линий продольных (L) и поперечных (T) колебаний.

Молекулярные кристаллы, основной объект наших исследований, обладают, как правило, низкой симметрией, и большей анизотропией кристаллического поля, в связи с чем применение полученных в гравии неочевидно. Трудности обработки фоновых спектров инверсии симметрических кристаллов усугубляются также наличием значительного числа перекрывающихся линий, а это требует дополнительной математической обработки спектрального контура.

В настоящей работе предложен метод определения абсолютной интенсивности линий ИР видных рентгеновых колебаний кристаллов любой симметрии с выделением вкладов от различных механизмов рассеяния. Значительное внимание удалено разработка методики определения абсолютной интенсивности линий ИР, выделено в них L0 и T0 колебания, а также разделение спектрального контура на индивидуальные составляющие.

§ 1. Кристаллическая среда в поле

системой волн

Определим поляризацию кристалла под воздействием электромагнитной волны падающего света

$$\bar{E} = E^0 (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \quad (1.1)$$

Для простоты рассмотрим область частот ω (1.1), малых по сравнению с частотой электронной диоптерии ω_e и больших по сравнению с частотой внешних колебаний ионов ω_i . Тогда поляризация среды будет иметь чисто электронную природу и инду-

цированные дипольные моменты молекул будут бессериально следовать за изменением поля \bar{E} , не оказывая влияния на собственные колебания молекулярного острова.

Величина индуцированного дипольного момента $\bar{P}^{(m)}$ зависит от поляризуемости молекулы f и действующего на неё локально-го поля $\bar{F}^{(m)}$ (m — номер молекулы в элементарной ячейке):

$$\bar{P}^{(m)} = \int_{V^{(m)}} \bar{f}^{(m)} \bar{F}^{(m)} \quad (1.2)$$

Локальное поле $\bar{F}^{(m)}$ представляет собой сумму внешнего поля $\bar{E}_1^{(m)}$ и поля $\bar{E}_2^{(m)}$, созданного на m -молекулу всеми окружающими диполями;

$$\bar{E}_1^{(m)} = \sum_n \nabla \nabla \left(\frac{1}{r_n} \right) \cdot \bar{P}^n \quad (1.3)$$

где $r_n = r_0 + \bar{r}^{(m)} - \bar{r}^{(m)}$, т.е. $\bar{r}^{(m)}$ радиус-вектор диполя, занимаемого положение n в элементарной ячейке, относительно центра m в "0" ячейке.

Таким образом, внутреннее поле $E_1^{(m)}$ определяется лишь структурой кристалла и величиной диполей в узлах решетки.

Наиболее изящный метод определения $\bar{E}_1^{(m)}$ был разработан Борном [8], который заменил суммирование в (1.3) интегрированием, начиная с некоторого радиуса R_0 . Однако, его рассмотрение обладает существенным недостатком — не были учтены эффекты запаздывания. Поэтому для динамических электромагнитных волн при $\bar{k} \rightarrow 0$ поле диполей в зоне R_0 определяется неизвестно, так как это будет зависеть от того, справа или слева стартует и куда значение волнового вектора k .

Эту неоднозначность можно преодолеть, если перейти от стационарных к переменным во времени полям $E(t, t)$ [9]. Тогда при расчете внутреннего поля следует учесть, что поле от каждого диполя $\bar{P}(r)$ будет проходить в зоне R_0 за время